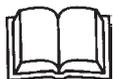


6. Михель К. Основы теории микроскопа.— М.: Машиностроение, 1955.  
 7. Скворцов Г. Е., Панов В. А., Поляков Н. И., Федин Л. А. Микроскопы.— Л.: Машиностроение, 1967.  
 8. Панов В. А., Андреев Л. Н. Оптика микроскопов. Расчет и проектирование.— Л.: Машиностроение, 1976.  
 9. Бегунов Б. Н., Заказов Н. П. Теория оптических систем.— М.: Машиностроение, 1973.  
 10. Бергер И., Гельбке К., Мелис Г. Практическая микрофотография.— М.: Мир, 1977.  
 11. Борн М., Вольф Э. Основы оптики.— М.: Наука, 1973.  
 12. Боровицкий В. Н. Выбор цифровой камеры для оптического микроскопа // Технология и конструирование в электронной аппаратуре (ТКЭА).— 2004.— № 1.— С. 21—26.

13. Боровицкий В. Н. Оптимизация цифрового фильтра для оценивания фокусировки изображений в цифровой оптической микроскопии // Там же.— 2005.— № 2.— С. 32—40.  
 14. Yong I. T., Zagers R., van Vliet L. J. et al. Depth-of-focus in microscopy // Proc. of the 8 Scandinavian Conference on Image Analysis.— Tromso, Norway.—1993.— С. 493—498.  
 15. Goldsmith N. T. Deep focus: a digital image processing techniques to produce improved focal depth in light microscopy // Image Analysis and Stereology.— 2000.— N 19.— P. 163—167.  
 16. Цыпкин А. Г., Цыпкин Г. Г. Математические формулы. Алгебра. Геометрия. Математический анализ: Справочник.— М.: Наука, 1985.

НОВЫЕ КНИГИ

НОВЫЕ КНИГИ



**С. И. Боридько, Н. В. Дементьев, Б. Н. Тихонов, И. А. Ходжаев. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. Учебное пособие / Под общей редакцией Б. Н. Тихонова.— М.: Горячая линия-Телеком, 2007. — 374 с.**

Рассмотрены основы метрологии, методы и средства электрорадиоизмерений, вопросы квалиметрии, стандартизации и оценивания соответствия. Рассмотрены вопросы автоматизации измерений, а также оценивание и поддержание качества радиоэлектронных изделий в процессе эксплуатации. Материал соответствует требованиям действующих нормативных документов в области метрологии, стандартизации, сертификации и технического регулирования, а также современным тенденциям развития теории измерений и измерительной техники.  
 Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», будет полезно студентам, обучающимся по направлениям «Телекоммуникации» и «Радиотехника», и специалистам.

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

- Разработка первичных источников тока. (Украина, г. Одесса)
- Вольт-фарадный метод прогнозирования напряжения отсечки ионно-имплантированных полевых транзисторов с барьером Шоттки на GaAs. (Украина, г. Днепропетровск)
- Измерение сопротивления силовых диодов под действием импульса ударного тока (Украина, г. Киев)
- Способ оптимизации профиля распределения концентрации носителей по толщине эпитаксиальных слоев (Узбекистан, г. Ташкент)
  - Новое поколение преобразователей ток-напряжение ППТН-02. (Украина, г. Черновцы)
  - Слоистый магнитный полупроводник  $FeIn_2Se_4$  и гетеропереход на его основе. (Украина, г. Черновцы)
  - Метод компенсации температурного ухода частоты в резонаторных СВЧ-измерителях на основе ГУН. (Украина, г. Днепропетровск)



в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции

в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции в портфеле редакции